

您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 科研动态

“低质量大形变指纹识别技术”获2010年度北京市科学技术奖励发明类二等奖

2012-04-17 | 【大 中 小】【打印】【关闭】

4月13日, 北京市委、市政府召开了北京市科学技术奖励大会, 田捷研究员等完成的项目“低质量大形变指纹识别技术”获2010年度北京市科学技术奖励发明类二等奖。田捷研究员代表获奖单位和完成人上台接受颁奖。

该项目针对指纹识别中的关键问题展开研究, 并提出了系列创新方法, 有效地解决了指纹识别应用中的挑战性问题: 在准确性研究方面, 解决了大形变指纹匹配问题; 在鲁棒性研究方面, 解决了低质量的指纹增强问题; 在安全性研究方面, 解决了隐私性和系统安全问题。

项目中的原始创新技术已在IEEE Transactions on PAMI、IP、IFS、SMC以及Pattern Recognition、PLoS ONE等本领域国内外主流学术期刊和会议上发表并被SCI、EI收录70余篇。项目已获相关核心发明专利12项, PCT国际发明专利1项, 受理并公开发明专利8项, 登记软件著作权18项。

本项目成果已形成系列产品, 并在国家计算机与网络信息安全管理中心的网络授权管理系统和中国邮政储蓄银行、中国农业银行等多家单位得到成功应用, 为我国电子政务和电子商务领域提供了一种安全可靠的身份认证技术。

- 科研动态
- 近日要闻
- 媒体扫描
- 头条新闻
- 学术活动